1K/2K/2K/4K/16 位 Microwire 串行 EEPROM——

CAT93C46/56/57/66/86

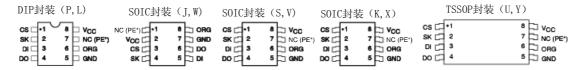
特性

- 高速操作:
 - -93C56/57/66: 1MHz
 - -93C46/86: 3MHz
- 低功耗CMOS工艺
- 工作电压范围: 1.8V~6.0V
- 存储器可选择×8位或者×16位结构
- 写入时自动清除存储器内容
- 硬件和软件写保护
- 上电误写保护
- 1,000,000 个编程/擦除周期
- 100年数据保存寿命
- 商业级、工业级和汽车级温度范围
- 连续读操作(除CAT93C46以外)
- 编程使能(PE)管脚(CAT93C86)
- 可采用新的无铅封装

描述

CAT93C46/56/57/66/86 是1K/2K/2K/4K/16K位的串行EEPROM存储器器件,它们可配置为16位(ORG 管脚接Vcc)或者8位(ORG管脚接GND)的寄存器。每个寄存器都可通过DI(或DO管脚)串行写入(或读出)。CAT93C46/56/57/66/86采用Catalyst公司先进的CMOS EEPROM浮动闸(floating gate)技术制造而成。器件可经受1,000,000次的编程/擦除操作,片内数据保存寿命高达100年。器件可采用8脚DIP,8脚SOIC或8脚TSSOP的封装形式。

管脚配置



^{*} 仅用于93C86。

管脚功能

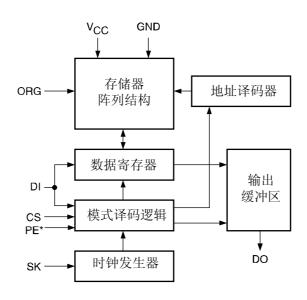
管脚名称	功能
CS	芯片选择
SK	时钟输入
DI	串行数据输入
DO	串行数据输出

续上表

管脚名称 功能						
V _{CC} +1.8V∼6.0V 电源电压						
GND	地					
ORG	存储器结构					
NC	不连接					
PE*	编程使能					

注释: 当ORG管脚连接到Vcc时,选择×16的结构。当ORG管脚连接到地时,选择×8的结构。如果ORG管脚悬空,内部的上拉电阻将选择×16的存储器结构。

方框图



绝对最大额定值

工作温度	55°C∼+125°C
储存温度	65°C∼+150°C
管脚对地电压(1)	2.0V~+Vcc +2.0V
Vcc 对地电压	2.0V~+7.0V
封装功耗(Ta=25℃)	1.0W
引脚焊接温度(10 秒)	300℃
输出短路电流 ⁽²⁾	100mA

*注释:

以上"绝对最大额定值"列出的是器件正常工作的额定值,并未涉及器件在这些条件或超出这些条件下的功能操作。器件不能长时间工作在绝对最大额定值条件下,否则会影响其可靠性。

可靠性

符号	参数	参考测试方法	最小	典型	最大	单位
$N_{END}^{(3)}$	耐久性	MIL-STD-883, 测试方法 1033	1,000,000			周期/字节
$T_{DR}^{(3)}$	数据保存时间	MIL-STD-883, 测试方法 1008	100			年
$V_{ZAP}^{(3)}$	ESD 敏感度	MIL-STD-883, 测试方法 3015	2000			V
$I_{LTH}^{(3)(4)}$	锁存	JEDEC 标准 17	100			mA

D.C.工作特性

 V_{CC} =+1.8V~+6.0V,除非特别说明。

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
I_{CC1}	电源电流 (写操作)	f _{SK} =1MHz			3	mA
		$V_{CC}=5.0V$				
I_{CC2}	电源电流 (读操作)	$f_{SK}=1MHz$			500	uA
		$V_{CC}=5.0V$				
I_{SB1}	电源电流(待机)(×8模式)	CS=0V			10	uA
		ORG=GND				
$I_{SB2}^{(5)}$	电源电流(待机)(×16模式)	CS=0V			0	uA
		ORG=-悬浮或V _{CC}				
I_{LI}	输入漏电流	$V_{IN}=0V\sim V_{CC}$			1	uA
I_{LO}	输出漏电流(包括ORG管脚)	$V_{OUT}=0V\sim V_{CC}$, CS=0V			1	uA
$V_{\rm IL1}$	输入低电压	$4.5V \le V_{CC} \le 5.5V$	-0.1		0.8	V
$V_{\rm IH1}$	输入高电压		2		V _{CC} +1	V
$V_{\rm IL2}$	输入低电压	$1.8V \le V_{CC} \le 2.7V$	0		$v_{cc} \times$	V
					0.2	
V_{IH2}	输入高电压		$V_{CC} \times 0.7$		V _{CC} +1	V
V_{OL1}	输出低电压	$4.5V \le V_{CC} \le 5.5V$			0.4	V
V _{OH1}	输出高电压	I _{OL} =2.1mA	2.4			V
		$I_{OH} = -400uA$				
V_{OL2}	输出低电压	$1.8V \le V_{CC} \le 2.7V$			0.2	V
V_{OH2}	输出高电压	I _{OL} =1mA	V _{CC} -0.2			V
		$I_{OH} = -100uA$				

注:

- (1) 最小的直流输入电压是 -0.5V。电压变化过程中,在小于20ns的时间内输入可能下冲到-2.0V。输出引脚的最大直流输出电压是Vcc+0.5V,在小于20ns的时间内可能上冲到Vcc+2.0V。
- (2) 输出短路的时间不能够超过1秒。一次只能有一个输出短路。
- (3) 这是最初测试的参数,设计或加工改变后可能会影响参数的值。
- (4) 锁存保护是在地址和数据引脚从-1V 到Vcc+1V 的时候强行向上的100mA 电流。
- (5) 93C46/56/57/66的特机电流(ISB₂)=0 μ A (<900nA), 93C86 的特机电流(ISB₂)=2 μ A。

管脚电容

符号	测试	条件	最小	典型	最大	单位
C _{OUT} ⁽³⁾	输出电容 (DO)	V _{OUT} =0V			5	pF
C _{IN} ⁽³⁾	输入电容(CS, SK, DI, ORG)	V _{IN} =0V			5	pF

指令集

指令	器件类型	起始	操作	地址	L .	数	:据	命令	PE ⁽²⁾
		位	码	X8	X16	X8	X16		
READ	93C46	1	10	A6-A0	A5-A0			读地址	
	93C56 ⁽¹⁾	1	10	A8-A0	A7-A0			AN-A0	
	93C66	1	10	A8-A0	A7-A0				
	93C57	1	10	A7-A0	A6-A0				
	93C86	1	10	A10-A0	A9-A0				X
ERASE	93C46	1	11	A6-A0	A5-A0			清除	
	93C56 ⁽¹⁾	1	11	A8-A0	A7-A0			地址	
	93C66	1	11	A8-A0	A7-A0			AN-A0	
	93C57	1	11	A7-A0	A6-A0				
	93C86	1	11	A10-A0	A9-A0				I
WRITE	93C46	1	01	A6-A0	A5-A0	D7-D0	D15-D0	写地址	
	93C56 ⁽¹⁾	1	01	A8-A0	A7-A0	D7-D0	D15-D0	AN-A0	
	93C66	1	01	A8-A0	A7-A0	D7-D0	D15-D0		
	93C57	1	01	A7-A0	A6-A0	D7-D0	D15-D0		
	93C86	1	01	A10-A0	A9-A0	D7-D0	D15-D0		I
EWEN	93C46	1	00	11XXXXX	11XXXX			写使能	
	93C56	1	00	11XXXXXXX	11XXXXXX				
	93C66	1	00	11XXXXXXX	11XXXXXX				
	93C57	1	00	11XXXXXX	11XXXXX				
	93C86	1	00	11XXXXXXXXX	11XXXXXXXX				X
EWDS	93C46	1	00	00XXXXX	00XXXX			写禁止	
	93C56	1	00	00XXXXXXX	00XXXXXX				
	93C66	1	00	00XXXXXXX	00XXXXXX				
	93C57	1	00	00XXXXXX	00XXXXX				
	93C86	1	00	00XXXXXXXX	00XXXXXXXX				X
ERAL	93C46	1	00	10XXXXX	10XXXX			清除所	
	93C56	1	00	10XXXXXXX	10XXXXXX			有地址	
	93C66	1	00	10XXXXXXX	10XXXXXX				
	93C57	1	00	10XXXXXX	10XXXXX				
	93C86	1	00	10XXXXXXXXX	10XXXXXXXX				I
WRAL	93C46	1	00	01XXXXX	01XXXX	D7-D0	D15-D0	写所有	
	93C56	1	00	01XXXXXXX	01XXXXXX	D7-D0	D15-D0	地址	
	93C66	1	00	01XXXXXXX	01XXXXXX	D7-D0	D15-D0		
	93C57	1	00	01XXXXXX	01XXXXX	D7-D0	D15-D0		
	93C86	1	00	01XXXXXXXXX	01XXXXXXXX	D7-D0	D15-D0		I

注:

- (1) 256×8 ORG的地址位A8 和128×16 ORG的地址位A7为任意值,但对于读、写和擦除命令必须置1或置0来实现操作。
- (2) 仅适用于93C86。
- (3) 这是最初测试的参数,设计或加工改变后可能会影响参数的值。

A.C.特性(93C56/57/66)

符号	参数			单	测试				
		V _{CC} =1.8V-6V*		V _{CC} =2.5V-6V		V _{CC} =4.5V-5.5V		位	条件
		最小	最大	最小	最大	最小	最大		
t _{CSS}	CS 建立时间	200		100		50		ns	
t _{CSH}	CS 保持时间	0		0		0		ns	
t _{DIS}	DI 建立时间	400		200		100		ns	
t _{DIH}	DI 保持时间	400		200		100		ns	
$t_{\rm PD1}$	输出延迟到1		1		0.5		0.25	us	
$t_{\rm PD0}$	输出延迟到0		1		0.5		0.25	us	$C_L = 100$
$t_{\rm HZ}^{(1)}$	输出延迟到高阻态		400		200		100	ns	pF
$t_{\rm EW}$	编程/擦除脉冲		10		10		10	ms	
t _{CSMIN}	CS 低电平最短时间	1		0.5		0.25		us	
t _{SKHI}	SK 高电平最短时间	1		0.5		0.25		us	
t _{SKLOW}	SK 低电平最短时间	1		0.5		0.25		us	
t _{SV}	输出有效状态延时		1		0.5		0.25	us	
SK _{MAX}	最大时钟频率	DC	250	DC	500	DC	1000	kHz	

^{*93}C56/57/66的初步数据。

A.C.特性 (93C46/86)

符号	参数		极限						测试
		V _{CC} =1.8V-6V*		V _{CC} =2.5V-6V		V _{CC} =4.5V-5.5V		位	条件
		最小	最大	最小	最大	最小	最大		
t _{CSS}	CS 建立时间	200		100		50		ns	
t_{CSH}	CS 保持时间	0		0		0		ns	
$t_{ m DIS}$	DI 建立时间	200		100		50		ns	
$t_{\rm DIH}$	DI 保持时间	200		100		50		ns	
$t_{\rm PD1}$	输出延迟到1		1		0.5		0.15	us	
t_{PD0}	输出延迟到0		1		0.5		0.15	us	$C_L = 100$
$t_{\rm HZ}^{(1)}$	输出延迟到高阻态		400		200		100	ns	pF
$t_{\rm EW}$	编程/擦除脉冲		5		5		5	ms	
t _{CSMIN}	CS 低电平最短时间	1		0.5		0.15		us	
t _{SKHI}	SK 高电平最短时间	1		0.5		0.15		us	
t _{SKLOW}	SK 低电平最短时间	1		0.5		0.15		us	
t _{SV}	输出有效状态延时		1		0.5		0.1	us	
SK _{MAX}	最大时钟频率	DC	500	DC	1000	DC	3000	kHz	

注释:

(1) 这是最初测试的参数,设计或加工改变后可能会影响参数的值。

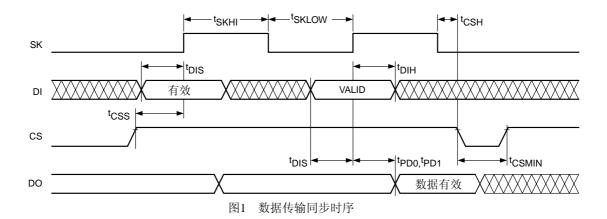
器件操作

CAT93C46/56(57)/66/86是一个1024/2048/4096/16,384位的非易失性存储器,可与工业标准的微处理器一同使用。CAT93C46/56/57/66/86可以选择为16位或8位结构。当选择为×16位结构时,93C46有7条9位的指令;93C57有7条10位的指令;93C56和93C66有7条11位的指令;93C86有7条13位的指令;这些指令用来

控制对器件的读、写和擦除操作。当选择×8位结构时,93C46有7条10位的指令;93C57有7条11位的指令;93C56和93C66有7条12 位的指令;93C86有7条14位的指令;由它们来控制对器件的读、写和擦除操作。CAT93C46/56/57/66/86的所有操作都在单电源上进行,执行写操作时需要的高电压由芯片产生。

指令、地址和写入的数据在时钟信号(SK)的上升沿时由DI引脚输入。DO引脚通常都是高阻态,读取器件的数据或在写操作后查询器件的准备/繁忙工作状态的情况除外。

写操作开始后,可通过选择器件(CS高)和查询DO脚来确定准备/繁忙状态; DO为低电平时表示写操作还没有完成,而DO为高电平时则表示器件可以执行下一条指令。如果需要的话,可在芯片选择过程中通过向DI管脚移入一个虚"1"使DO管脚重新回到高阻态。DO管脚将在时钟(SK)的下降沿进入高阻态。建议在DI和DO管脚连接在一起来形成一个共用的DI/O管脚的应用中使DO管脚进入高阻态。



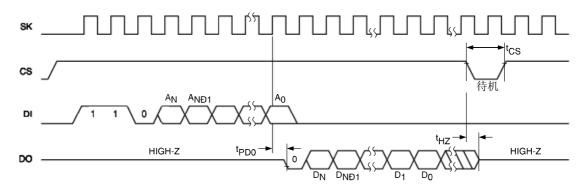


图2a 读指令时序 (93C46)

发送到器件的所有指令的格式为:一个高电平"1"的起始位,一个2位(或4位)的操作码,6位(93C46)/7位(93C57)/8位(93C56或93C66)/10位(93C86)(当选择 \times 8位结构时加一位)及写入数据时的16位数据域(选择8位结构时为 \times 8位)。

注释:该注释仅适用于93C86。写、擦除、全写和全擦除指令要求 PE=1。如果PE引脚悬空,93C86进入编程使能模式。对于写使能和写禁止指令,PE 可以为任意值。

读操作

在接收到一个读命令和地址(在时钟作用下从DI 管脚输入)时,CAT93C46/56/57/66/86的DO管脚将退出高阻态,且在发送完一个初始的虚0位后,DO管脚将开始移出寻址的数据(高位在前)。输出数据位在时钟信号(SK)的上升沿触发,经过一定的延迟时间后才能稳定(t_{PD0} 或 t_{PD1})。

在第一个数据字移位输出后且保持CS有效和时钟信号SK连续触发时,CAT93C46/56/66/86将自动加1 到下一地址,并且在连续读模式下移出下一个数据字。只要CS持续有效且SK连续触发,器件使地址不断地 增加直至到达器件的末地址,然后再返回到地址0。在连续读模式下,只有第一个数据字在虚拟0位的前面。 所有后续的数据字将没有虚拟0位。

写操作指令(WRITE):

在接收到写指令、地址和数据以后,CS(芯片选择)管脚不选芯片的时间要必须大于t_{CSMIN}。在CS的下降沿,器件将启动对指令指定的存储单元的自动时钟擦除和数据保存周期。器件进入自动时钟模式后无需使用SK管脚的时钟(注释1)。CAT93C46/56/57/66/86的准备/繁忙状态可通过选择器件和查询DO管脚来确定。由于该器件有在写入之前自动清除的特性,所以没有必要在写入之前擦除存储器单元的内容。

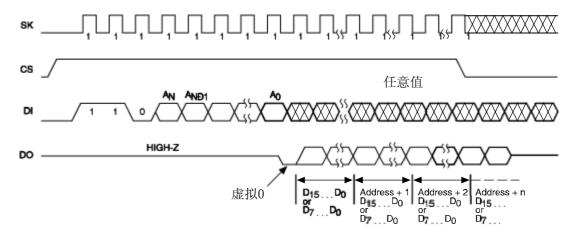
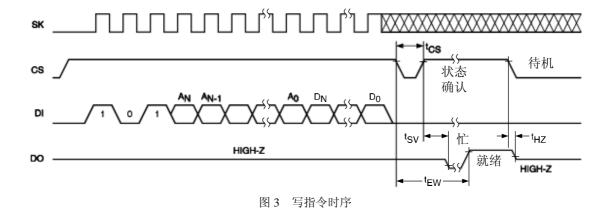


图 2b 读指令时序 (93C56/57/66/86)



擦除

接收到擦除指令和地址时,CS(芯片选择)管脚不选芯片的时间要必须大于t_{CSMIN}。在CS的下降沿时,器件启动选择的存储器单元的自动时钟清除周期。器件进入自动时钟模式后无需使用SK管脚的时钟(注释 1)。CAT93C46/56/57/66/86的准备/繁忙状态可通过选择器件和查询DO管脚来确定。一旦清除,已清除单元的内容返回到逻辑"1"状态。

擦除/写使能和禁能

CAT93C46/56/57/66/86在写禁止状态下上电。上电或EWDS(写禁止)指令后的所有写操作都必须在 EWEN(写使能)指令之后才能启动。一旦写指令被使能,它将保持使能直到器件的电源被移走或EWDS 指令被发送。EWDS指令可用来禁止所有对CAT93C46/56/57/66/86的写入和擦除操作,并且将防止意外地对器件进行写入或擦除。无论写使能还是写禁止的状态,数据都可以照常从器件中读取。

全擦除

在接收到ERAL指令时,CS(芯片选择)管脚不选芯片的时间要必须大于t_{CSMIN}。在CS的下降沿,器件将启动所有存储器单元的自动时钟清除周期。器件进入自动时钟模式后无需使用SK管脚的时钟(注释1)。CAT93C46/56/57/66/86的准备/繁忙状态可通过选择器件和查询DO管脚来确定。一旦清除,所有存储器位的内容返回到逻辑"1"状态。

全写

接收到WRAL指令和数据时,CS(芯片选择)管脚不选芯片的时间要必须大于t_{CSMIN}。在CS的下降沿,器件将启动自动时钟把数据内容写满器件的所有存储器。器件进入自动时钟模式后无需使用SK管脚的时钟(注释1)。CAT93C46/56/57/66/86的准备/繁忙状态可通过选择器件和查询DO管脚来确定。没有必要在WRAL命令执行之前将所有存储器内容清除。

注释1:该注释仅适用于CAT93C46。最后一个数据位采样后,必须在时钟(SK)的下一个上升沿之前拉低片选信号(CS)来启动自定时的高电压周期。这一点是很重要的,因为如果CS在该指定的框架窗口之前或之后拉低,寻址单元将不会被编程或擦除。

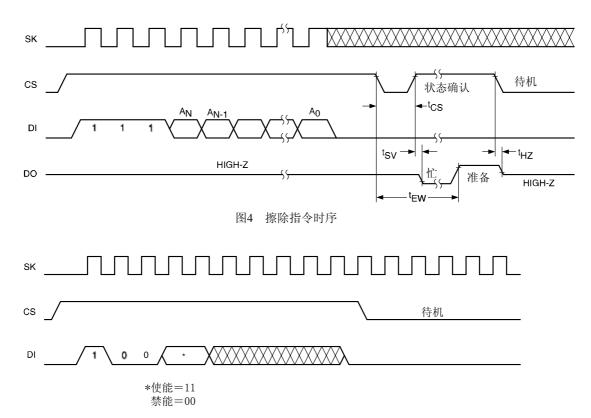


图5 EWEN/EWDS指令时序

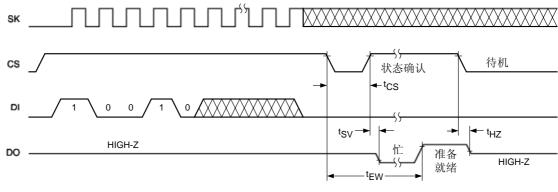


图6 ERAL指令时序

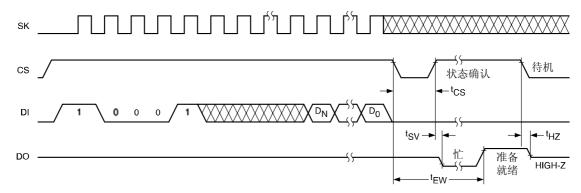
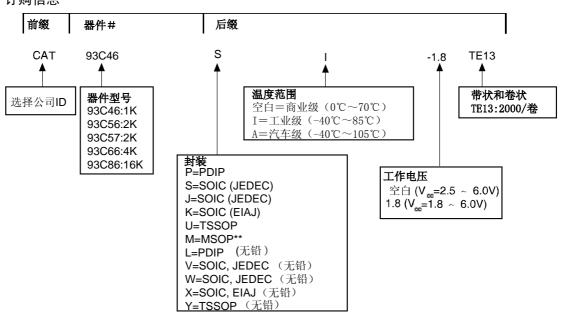


图7 WRAL指令时序

订购信息



*-40℃~+125℃需要订做。

注释:

(1) 以上是一个 93C46SI-1.8TE13 的例子(SOIC,工业级温度,工作电压在1.8V~6V,带状和卷状)。